INTERNATIONAL STANDARD

ISO 14701

Second edition
2018-11

Surface chemical analysis — X-ray photoelectron spectroscopy — Measurement of silicon oxide thickness

Analyse chimique des surfaces — Spectroscopie de photoélectrons par rayons X — Mesurage de l'épaisseur d'oxyde de silicium

Reference number
ISO 14701:2018(E)

© ISO 2018

Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation

4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn